



(11) **EP 2 817 650 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 84

(51) Int Cl.:
G01R 35/00 ^(2006.01) **G01R 27/28** ^(2006.01)
G01D 21/00 ^(2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
06.03.2019 Patentblatt 2019/10

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2013/053337

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
26.12.2018 Patentblatt 2018/52

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2013/124295 (29.08.2013 Gazette 2013/35)

(21) Anmeldenummer: **13709335.7**

(22) Anmeldetag: **20.02.2013**

(54) **SYSTEM UND VERFAHREN ZUR KALIBRIERUNG EINER MESSANORDNUNG UND ZUR
CHARAKTERISIERUNG EINER MESSHALTERUNG**

SYSTEM AND METHOD FOR CALIBRATING A MEASURING DEVICE AND FOR CHARACTERIZING
A MEASURING FIXTURE

SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CALIBRATION D'UN DISPOSITIF DE MESURE ET DE
CARACTÉRISATION D'UN MONTAGE DE MESURE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IS IT LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT
RO RS SE SI SK SM TR**

(74) Vertreter: **Körfer, Thomas et al**
Mitscherlich PartmbB
Patent- und Rechtsanwälte
Sonnenstrasse 33
80331 München (DE)

(30) Priorität: **20.02.2012 DE 102012003285**
06.02.2013 DE 102013201914

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A1- 2 241 899

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
31.12.2014 Patentblatt 2015/01

(73) Patentinhaber: **Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG**
81671 München (DE)

(72) Erfinder:
• **SCHMIDT, Lorenz-Peter**
91093 Heßdorf (DE)
• **SCHRAMM, Marcus**
96129 Strullendorf (DE)
• **HROBAK, Michael**
10249 Berlin (DE)
• **SCHÜR, Jan**
91094 Langensendelbach (DE)

- **YUNZHANG ET AL: "Measurement of a reciprocal four-port transmission line structure using the 16-term error model", MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, Bd. 49, Nr. 7, Juli 2007 (2007-07), Seiten 1511-1515, XP055066964, ISSN: 0895-2477, DOI: 10.1002/mop.22498**
- **MARCUS SCHRAMM ET AL: "MOS-16: A new method for in-fixture calibration and fixture characterization", MICROWAVE MEASUREMENT CONFERENCE (ARFTG), 2011 77TH ARFTG, IEEE, 10. Juni 2011 (2011-06-10), Seiten 1-7, XP031972673, DOI: 10.1109/ARFTG77.2011.6034560 ISBN: 978-1-61284-959-1 in der Anmeldung erwähnt**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 2 817 650 B8